

X線構造解析研修コース

低分子単結晶コース 及び 粉末コース

【内容】

1. X線回折の基礎
2. X線発生装置及び回折データ測定装置の概要
- 3-1. 単結晶X線結晶構造解析実習（低分子単結晶コース）
 - (1) 単結晶の作成法, (2) 単結晶の選別, (3) 回折データの予備測定による品質判定
 - (4) 回折データ測定, (5) 構造解析, (6) 解析データのとりまとめ
- 3-2. 粉末X線構造解析実習（粉末コース）
 - (1) 試料の作製, (2) 測定：消滅則の確認,
 - (3) 測定：ナノ粒子サンプルを用いた結晶子径の確認, (4) 解析データのとりまとめ

【主催】

筑波大学 研究戦略イニシアティブ「学際物質科学」

【日時】

2010年1月18日(月) 13:30～17:00頃

【会場】

第1エリア自然系学系棟 1C402, 1C406

【定員】

低分子単結晶コース、粉末コース、共に若干名
(これまでX線回折による構造解析を行った経験のない方、初心者の方の受講も歓迎致します。
また低分子単結晶コースで使用する装置はBrukerAXS社製 SMART APEXIIで、本学分析センターに設置を予定している装置と同型機になります。)

【参加登録】

参加登録費：無料

申込方法：(1) 氏名, (2) 一般・学生・研究員の別, (3) 所属, (4) 連絡先 を明記してE-mailで下記連絡先にお申し込み下さい。

参加登録締切：1月8日(土)

申し込み・問い合わせ先：筑波大学数理物質科学研究科（化学系） 一戸雅聡

ichinohe@chem.tsukuba.ac.jp

